



産学官連携で、ものづくり支援 鈴鹿高専テクノプラザ

〈入会のご案内〉

設立の目的

- 企業の技術活性化に、鈴鹿高専の人的・知的技術資源を活用し役立てます。
- 地域産業界の連携・交流を深め、地域産業の発展に、鈴鹿高専と協働します。
- 企業の参加で、鈴鹿高専の教育研究の振興に協力します。

事業内容と 入会の特典

●研究に関する協働事業

地域産業・企業の課題について、鈴鹿高専と共同研究、委託研究、委託試験などとしてご支援いたします。

●企業の人材育成

リフレッシュ教育のために、技術講習会、研修会の開催を通して、キャリアアップのお手伝いをいたします。

●人材確保の支援、企業PR

企業と学生を結び、就職につなげるため、「企業ガイドブック」を発行して学生に配布し、就職指導会などの資料として活用します。

●鈴鹿高専の学生との交流の促進

エンジニアリングデザイン能力を養う創造活動プロジェクトや創造活動に基づく知的財産教育の機会を通して、学生との交流・支援の場を提供します。

会員企業



鈴鹿高専



会費

年会費

法人会員は一口3万円、個人会員（終身）は一口3万円

振込先

百五銀行 旭が丘支店

〔普通預金口座〕 338602 〔名義〕スズカコウセンテクノプラザ

お問い合わせ・お申込みは下記連絡先までお気軽に！

連絡先

鈴鹿工業高等専門学校 総務課（鈴鹿高専テクノプラザ 事務局）

Tel 059-368-1717

〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町

FAX: 059-387-0338 Mail: technoplaza@jim.suzuka-ct.ac.jp

事業内容

1. 会員企業との共同研究，研究協力の推進

- (1) 共同研究・受託研究に関する助成
- (2) 技術相談ならびに学内の研究設備利用に関する
会員への便宜
- (3) 会員企業との共同研究等推進に関する助成
- (4) ランチミーティングによる取組み

2. 産学官の人的、情報交流の促進

企業交流会の開催

3. 会員企業の技術向上に関する支援

- (1) 企業技術者対象の講習会の実施
- (2) 企業見学会の実施
- (3) 講演会の開催
- (4) 高専教員の企業訪問による「出前講座」の開催
- (5) メール等による会員企業向けの情報提供

4. 人材確保の支援，企業PR

- (1) 「企業ガイドブック」の作成:就職希望学生に提供し紹介
- (2) 「合同業界説明会」での就職希望学生向け会員企業紹介
:就職希望学生を対象に，ブース 形式による個別相談会
を実施
- (3) 高専祭での会員企業展示
- (4) 銘板への企業会員名の掲載（事務教養棟玄関）
- (5) 産業展での活動紹介
- (6) 企業会員の情報共有における企業取組み発信
- (7) 高専卒業生の転職、Uターン就職希望者
- (8) 高専OBによる知的シルバー人材活用

5. 高専の教育，国際交流の充実の支援および学生との交流の促進

- (1) 高専の技術者教育に関する支援
- (2) 高専祭学科展示作品の審査と優秀作品の表彰
- (3) 学生海外派遣支援
- (4) 会員企業による授業支援



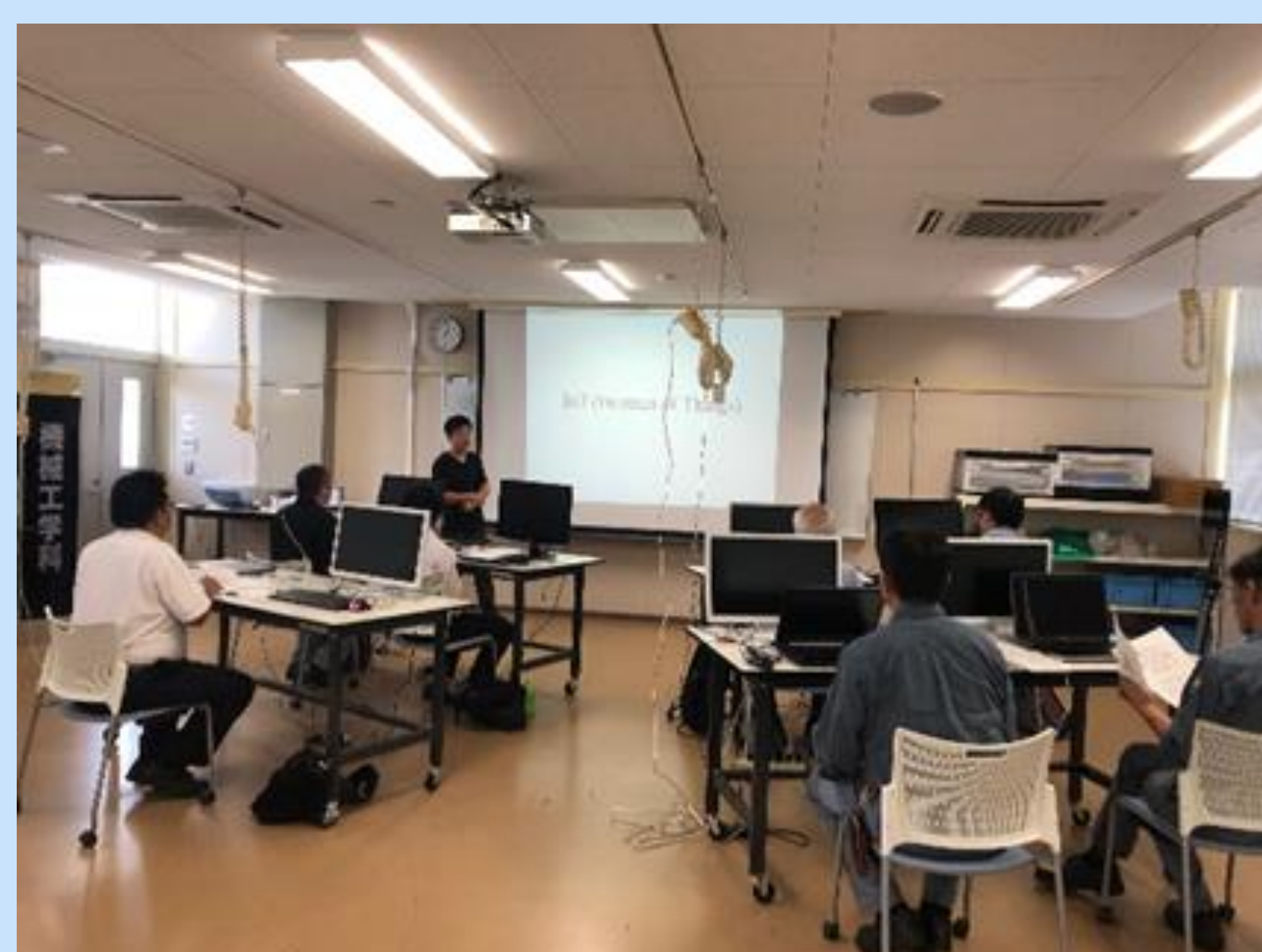
会員企業の銘板設置



企業ガイドブックの発行



高専祭の風景



企業技術者対象の講習会



合同業界説明会の開催



企業見学会の実施



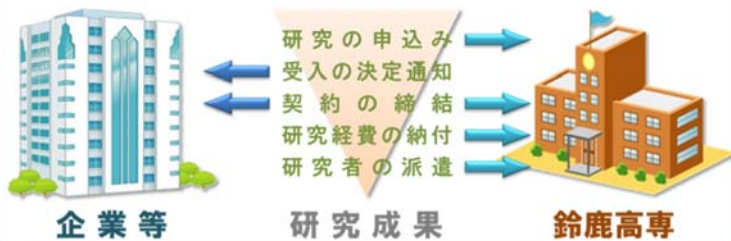
鈴鹿高専テクノプラザが推進する 研究に関する協働事業の取組み

鈴鹿高専では研究協力制度を設け、地域企業等との連携強化に努めています。「研究設備利用制度」、「技術相談制度」があり、鈴鹿高専テクノプラザ会員には優遇措置もありますので、お気軽に鈴鹿高専地域連携係（chiiki@jim.suzuka-ct.ac.jp）までお問い合わせください。

鈴鹿高専における研究協力制度

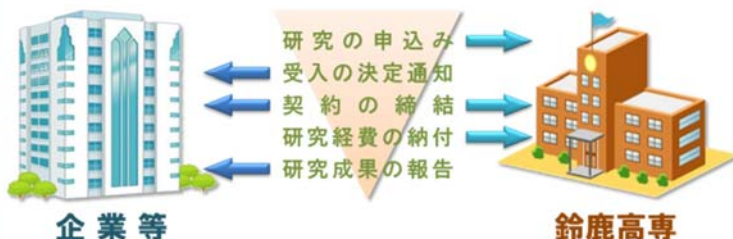
共同研究

共同研究とは企業等と鈴鹿高専の研究者とが共通のテーマについて対等な立場で研究を行う制度です。



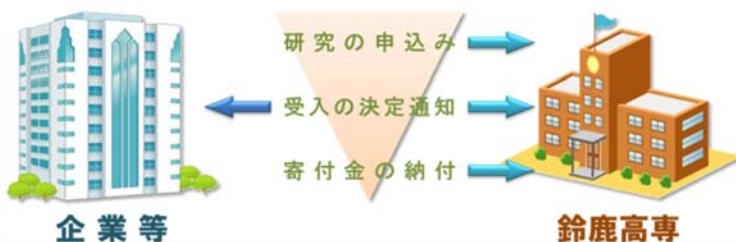
受託研究

「受託研究」とは企業等から委託を受け、本校研究者が研究を実施し、その成果を委託者に報告する制度です。



寄付金

本校の学術研究や教育の充実の奨励、支援を目的として広く寄附金を受け入れています。



主な研究設備の紹介



300 kV の加速電圧で点分解能 0.18nm での観察が可能な TEM です。物体を最大 15 万倍まで拡大して観察できます。

300kV 級透過電子顕微鏡 (TEM)

SEM で観察しながら表面のイオンビーム加工が可能であり、観察面の組成分析、結晶方位解析が可能な電子顕微鏡です。



集束イオン/電子ビーム加工観察装置 (FIB/SEM)



固体、液体、粉体を問わず、試料の構成元素を非破壊で分析出来ます。

蛍光 X 線分析装置

レーザー光を試料に照射して、試料表面の分子の結合状態に関する情報が得られます。



レーザーラマン分光光度計